

第26回三次元工学シンポジウム

最新の計測検査技術

同時開催
国際画像
機器展

7

(水)

- ・開会の挨拶 吉澤 徹 (NPO 三次元工学会)
- ・司会 細井正久 (ソニーテクノクリエイティブ株式会社)

10:00

リンググラフィにおける逆問題手法による光計測 (一部調整中)

稲 秀樹 (キヤノン株式会社)

<Key Words> 逆問題手法の基本、高速高精度計測、光 CD(Critical Dimension) 計測

10:40

新開発技術「広視野レーザ位相差顕微鏡」

(有限会社高度技術研究所、茨城高専名誉教授) 清水 勲

<Key Words> 生体細胞、高解像、非染色、実時間検査、In-line ホログラム

11:20

Laser Radar の計測技術と自動車産業への適用例 日高康弘(株式会社ニコン)

<Key Words> TOF による測距、FMCW 方式、ロボットとの連携、自動車産業

12:00

8

(木)

- ・司会 井口 潔 (元・シチズンマシナリ株式会社)

光コムを活用した非接触・高速三次元形状計測

野田直孝 (株式会社光コム 取締役 COO 上席システムコンサルタント)

<Key Words> 光コムの原理、全数インライン測定によるインダストリー 4.0 の実現

10:40

人体三次元計測とアパレル電子商取引 持丸正明、河内まき子(産業技術総合研究所)

<Key Words> 人体形状、デジタルヒューマン、国際標準

11:20

デジタルホログラフィの最新動向ーデジタルホログラフィは何に使えるか！ー

早崎芳夫 (宇都宮大学オブティクス教育研究センター)

<Key Words> 位相イメージング、工業計測、バイオ計測、蛍光ホログラフィ、ナノ粒子計測

12:00

2016.12/7(水)・8(木)

パシフィコ横浜 2F アネックスホール F204

● 参加費：1名1日参加(資料1部) ¥3,000

● 講演時間：40分(質疑討論を含む)

● お申し込み方法：下記ホームページよりお申し込みください。

<http://www.adcom-media.co.jp/ite/sanjigen/>
折り返しメールにて参加票をお送りいたします。当日は参加票をご持参のうえで、定刻 10:00 までに会場受付にて参加費をお支払いください。定刻を過ぎた場合はキャンセルとなります。受付の混雑を避けるため、当日は釣り銭がないようにご用意ください。

※申込み受付終了 11月30日(水)

● お問い合わせ先：NPO 三次元工学会

〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷 4-13-18 リック岸谷 1F

E-mail toru@3dsoc.org

※プログラムは <http://adcom-media.co.jp/ite/sanjigen/> にて最終確認ください。(一部未定の点があります。)